

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0498U002741

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 29-12-1998

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



## II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Прядкин Сергей Леонидович

2. Прядкин Сергей Леонидович

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: dashboard/okd.okd\_type\_names.0

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 01.04.18

Назва наукової спеціальності: Фізика і хімія поверхні

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 23-12-1998

Спеціальність за освітою: 7.070101

Місце роботи здобувача: Інститут фізики напівпровідників НАН України

Код за ЄДРПОУ: 5416252

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

### **III. Відомості про організацію, де відбувся захист**

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** Д 26.168.01

**Повне найменування юридичної особи:** Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

**Код за ЄДРПОУ:** 05417331

**Місцезнаходження:** бульв. акад. Вернадського, 36, м. Київ, Київська обл., 03142, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Національна академія наук України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію**

**Повне найменування юридичної особи:** Інститут фізики твердого тела РАН

**Код за ЄДРПОУ:** 269978

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:**

**Коди тематичних рубрик:** 29.19.19, 29.19.23

**Тема дисертації:**

1. Использование сканирующей туннельной микроскопии для изучения поверхности твердых тел проводников

2.

**Реферат:**

1. Объект исследования: Поверхности монокристаллов (110)W, (100)W, (0001)YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-x</sub>, (111)Si. Цель исследования: Изучение влияния морфологии поверхности на рассеяние электронов проводимости, электронных свойств поверхности и методов нанолитографии на поверхности. Методы исследования и аппаратура: Сканирующая туннельная микроскопия, комнатный, криогенный и сверхвысоковакуумный СТМ. Теоретические результаты и новизна: Впервые с помощью моделирования рассеяния электронов на определенном с помощью СТМ рельефе поверхности объяснены результаты по фокусировке электронов проводимости от поверхности (100) вольфрама. Практические результаты и новизна: Впервые на сколах YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-x</sub> in situ измерена щель, разработаны методы нанографической модификации с широким диапазоном создаваемых особенностей на поверхности (111) Si, получены изображения атомно чистой поверхности (100)Cu и поверхности Cu(100)Cl. Предмет и степень внедрения: Публикации, патент, доклады, практическое использование. Сфера (область) использования: Физика твердого тела, физика поверхности,

нанотехнологія.

2.

**Державний реєстраційний номер ДіР:**

**Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:**

**Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:**

**Підсумки дослідження:**

**Публікації:**

**Наукова (науково-технічна) продукція:**

**Соціально-економічна спрямованість:**

**Охоронні документи на ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:**

**Зв'язок з науковими темами:**

## **VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Цой В.С.

2. Цой В.С.

**Кваліфікація:** д.ф.-м.н., 01.04.07

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

## **VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів**

**Офіційні опоненти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Черепин В.Т.

2. Черепин В.Т.

**Кваліфікація:** д.ф.-м.н., 01.04.07, 1

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Бекетов Г.В.

2. Бекетов Г.В.

**Кваліфікація:** к.ф.-м.н., 01.04.10

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Рецензенти**

## **VIII. Заключні відомості**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові  
голови ради**

Васильев М.А.

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові  
головуючого на засіданні**

Васильев М.А.

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

**Реєстратор**

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є  
відповідальним за реєстрацію наукової  
діяльності**



Юрченко Т.А.